



Fraunhofer

Institut

Solare Energiesysteme

Dział: Systemy Termiczno-optyczne

Grupa: Badania materiałowe

Fax: +49 761 401 6681

Protokół z pomiarów

Pomiar stopnia odbijalności oraz stopnia emisji

Procedura pomiarowa

Stopień odbijania jak i stopień emisji określone są pośrednio przez pomiar spektralnego hemisferycznego stopnia odbijania niemalże pionowego promieniowana w obszarze pomiędzy 0.36 μm a 17 μm (8' w stosunku do próby normalnej). Stosuje się w tym celu Sektometr Fourier IFS 66 firmy Bruker. Dla środkowego obszaru podczerwieni (1.7 μm – 17 μm) stosuje się kulę powlekaną diffus – Gold a dla obszaru ultrafioletowego kulę pokrytą PTFE. W celu kalibracji stosuje się odbijające standardy porównawcze firmy Labsphere. W celu korekty błędu INDIKATRIX pomiędzy próbką a standardem mierzona jest dyfuzyjna refleksja próbki oraz jej relatywny udział przy częściowo pomieszczeniowej refleksji (TIS).

Opis próbek

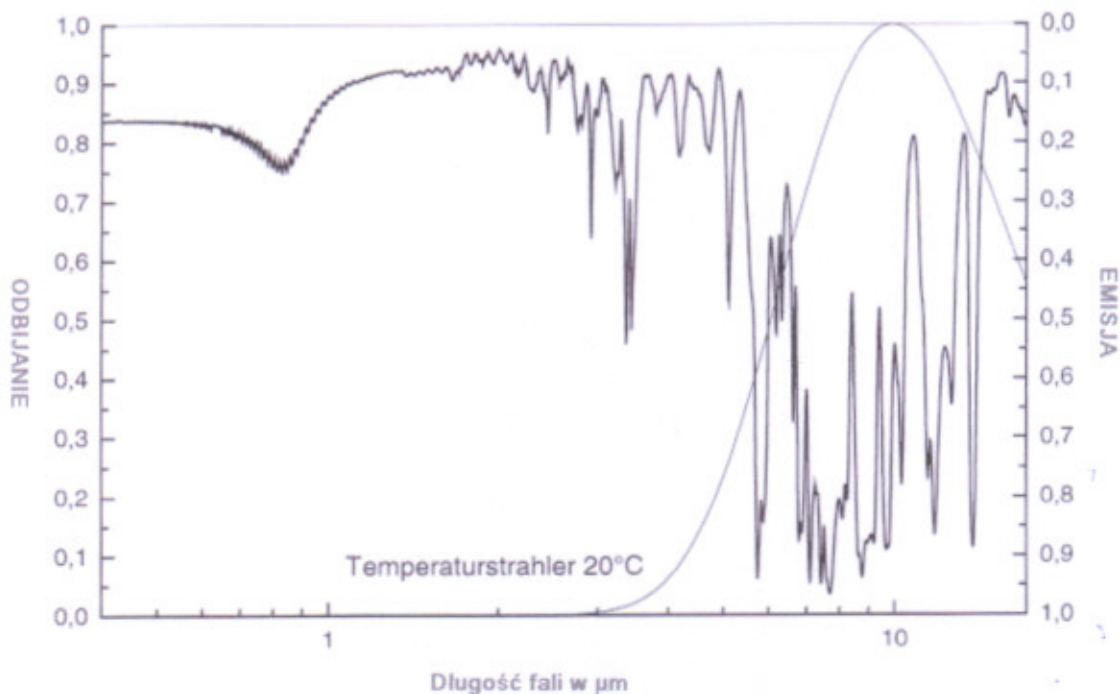
Zleceniodawca	Ewald Doerken AG
Oznaczenie próbek	Delta Reflex DSC
Materiały	pokryta naporowanym aluminium folia poliestrowa
Numer referencyjny	z-doer1
Data przyjęcia próbek	27.08.97
Data pomiaru	27.08.97
Uwagi	gładka strona



Wyniki badań

Oznaczenie próbek	strona 1 (strona gładka/z-doer1)	
Stopień odbijalności (293K)	48.4%	+/- 2%
Stopień emisji (293K)	51.6%	+/- 2%

Spektrum półpomieszczeniowego stopnia odbijalności aż po niemalże pionowe promieniowanie:



Freiburg den 19.05.2000

[Signature]
Für die Durchführung

Fraunhofer ISE, TOS-Mat, 19.05.00

[Signature]
Gruppenleiter Materialforschung